

عنوان مقاله:

بررسی ریخت شناسی لایه های نازک اکسید روی به روش سل-ژل با پایدارکننده های مختلف

محل انتشار:

دومین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

سیده فهیمه حیدری ارچنگانی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

حسن اله داغی - عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، گروه فیزیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

جواد باعدی - عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، گروه فیزیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

محمد زیرک - عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، گروه فیزیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

خلاصه مقاله:

روش های کلی ساخت لایه های نازک به دو دسته روش های فیزیکی و شیمیایی تقسیم می شوند که در اینمیان روش های شیمیایی روش های ساده و مقرون به صرفه هستند که اگر به خوبی اجرا شوند می توانند تاحد خوبی قابل اعتماد باشند. سل-ژل یکی از روش های شیمیایی است که می توان لایه اکسید روی (ZnO) براحتی توسط لایه نشانی چرخشی روی سطح نشانده. تنظیم دقیق پارامترهای لایه نشانی منجر به ساخت دقیقترین لایه ها می شود. در این کار با استفاده از سه پایدار کننده ی مختلف منو، دی و تری اتانول آمین و زمان های متفاوت ژل شدن، لایه های ZnO با استفاده میکروسکوپ کانفوکال و طیف سنج نوری از نظر ساختار و مورفولوژی بررسی شد.

کلمات کلیدی:

ریخت شناسی، اکسید روی، لایه نازک، سل-ژل

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1012460>

